

OBSAH

1.	Mikroskopické techniky	3
1.1	Optická mikroskopie	3
1.1.1	Klasický optický mikroskop	4
1.1.1.1	Zobrazování v mikroskopu	4
1.1.1.2	Rozlišovací schopnost a užitečné zvětšení mikroskopu	5
1.1.1.2.1	Pozorovaný preparát je sám zdrojem světla	5
1.1.1.2.2	Předmět je osvětlován cizím světlem	8
1.1.1.3	Hloubka ostrosti preparátu	13
1.1.1.4	Prvky mikroskopu	14
1.1.1.4.1	Objektivy	14
1.1.1.4.2	Okuláry	15
1.1.1.4.3	Osvětlovací soustava mikroskopu	15
1.1.1.4.4	Čočky	16
1.1.1.4.4.1	Vady čoček	17
1.1.1.4.5	Optické filtry v mikroskopii	18
1.1.2	Polarizační mikroskopie	19
1.1.2.1	Měření dvojloamu	24
1.1.2.2	Index lomu průhledných tuhých látek	24
1.1.3	Mikroskopie fázových preparátů	25
1.1.3.1	Mikroskopie s fázovým kontrastem	26
1.1.3.2	Interferenční mikroskopie	29
1.1.4	Metalografická mikroskopie	35
1.1.5	Měření mikrotvrdoosti	37
1.1.6	Vysokoteplotní mikroskop	38
1.2	Elektronová mikroskopie	41
1.2.1	Princip elektronové optiky	43
1.2.2	Rozlišovací schopnost	45
1.2.3	Kontrast obrazu preparátu	46
1.2.4	Konstrukční části elektronového mikroskopu	47
1.2.4.1	Osvětlovací soustava	47
1.2.4.2	Provedení elektronových čoček	48
1.2.4.3	Vady elektronových čoček	49
1.2.4.4	Clony v elektronovém mikroskopu	50
1.2.4.5	Pozorování obrazu	50
1.2.4.6	Příklad elektronového mikroskopu	51
1.2.5	Druhy elektronové mikroskopie	53
1.2.5.1	Prozařovací elektronový mikroskop	53
1.2.5.2.	Emisní elektronový mikroskop	53
1.2.5.3.	Reflexní elektronový mikroskop	53

1.2.5.4.	Elektronová difrakce	53
1.2.5.5.	Rastrovací elektronový mikroskop	54
1.2.6.	Příprava preparátu pro pozorování v elektronovém mikroskopu	57
1.3	Moderní mikroskopické metody	60
1.3.1	Videomikroskopie	61
1.3.2	Konfokální rastrovací mikroskopie	64
1.3.3	Infračervená mikroskopie s Fourierovou transformací	66
1.3.3.1	Princip FTIR	66
1.3.3.2	Reflexní analýza	67
1.3.3.3.	Další varianty FTIR	69
1.3.3.3.1	Mikroskopie s klouzavým úhlem	69
1.3.3.3.2	ATR - mikroskopie	70
1.3.4.	Fotoakustická mikroskopie	70
1.3.4.1.	Fotoakustický jev	71
1.3.4.2.	Fotoakustická mikroskopie	71
1.3.4.3.	Fotoakustická spektroskopie	73
1.3.5	Akustická mikroskopie	73
1.3.6.	Mikroskopie s elektromechanickou sondou	75
1.3.6.1.	Obecná charakteristika SPM	75
1.3.6.2.	Mikroskop atomárních sil	76
1.3.6.3.	Rastrovací tunelový mikroskop	78
1.3.6.4.	Aplikační možnosti SPM	79
1.3.6.5.	Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli	81
1.4	Literatura (Mikroskopické techniky)	82
2.	Stanovení velikosti částic a měření povrchu	83
2.1	Stanovení velikosti částic a jejich rozdělení	84
2.1.1	Rozdělení velikosti částic	84
2.1.1.1	Kvantitativní hodnocení zrnitosti	86
2.1.1.2	Metody stanovení rozdělení velikosti částic	98
2.1.1.2.1	Sítová analýza	99
2.1.1.2.1.1	Suché sítování	99
2.1.1.2.1.2	Mokré sítování	100
2.1.1.2.2	Mikroskopické metody	100
2.1.1.2.3	Sedimentační a proudové metody	103
2.1.1.2.4	Optické metody využívající rozptylu světla	107
2.1.1.2.4.1	Fraunhoferův ohyb světla na částici	110
2.1.1.2.4.2	Metoda dynamického rozptylu světla	112
2.1.1.2.5	Metody založené na změně elektrické vodivosti	115
2.1.1.2.6	Hlavní trendy ve vývoji komerčních zařízení pro měření velikosti částic (PSD)	116
2.1.1.2.7	Přesnost a reproducibilnost výsledků měření velikosti částic	117

2.2	Měřmý povrch práškových látok	118
2.2.1	Výpočet měrného povrchu z granulometrické křivky	119
2.2.2	Metody propustnostní	119
2.2.3	Metody měření měrného povrchu pomocí sorpce plynů a par	123
2.2.3.1	Adsorpce plynů	123
2.2.3.1.1	Odvození rovnice izotermy BET	127
2.2.3.2	Adsorpční metody pro měření povrchu	130
2.2.3.2.1	Objemová metoda BET	130
2.2.3.2.2	Chromatografická metoda	132
2.2.3.2.3	Stanovení měrného povrchu areametrem	133
2.3	Literatura (Stanovení velikosti častic a měření povrchu)	134
3.	Metody termické analýzy	135
3.1	Rozdělení metod termické analýzy	137
3.2	Metody spojené se změnou obsahu složek zkoumané látky	139
3.2.1	Termogravimetrie	139
3.2.1.1	Teoretické základy termogravimetrie	139
3.2.1.2	Přístrojové vybavení termogravimetrie	142
3.2.1.3	Možnosti využití termogravimetrie	145
3.2.1.4	Vyhodnocení termogravimetrických křivek	146
3.2.1.5	Faktory ovlivňující termogravimetrická měření	148
3.2.2	Detekce a analýza uvolněných plynů	157
3.2.3	Diferenční tlaková analýza	159
3.3	Metody spojené se změnou tepelných vlastností zkoumané látky	159
3.3.1	Diferenční termická analýza	159
3.3.1.1	Teoretické základy DTA	159
3.3.1.2	Možnosti využití DTA	163
3.3.1.3	Klasifikace DTA	167
3.3.1.4	Přístrojové vybavení DTA	167
3.3.1.4.1	Pece	168
3.3.1.4.2	Měření teploty	170
3.3.1.4.3	Kalibrace teplotní osy	173
3.3.1.4.4	Nosič vzorků	175
3.3.1.4.5	Volba referentní látky	176
3.3.1.5	Faktory ovlivňující DTA měření	176
3.3.1.5.1	Vlivy experimentálních podmínek	177
3.3.1.5.2	Vliv fyzikálních a chemických vlastností vzorku	182
3.3.2	Simultánní TG - DTA	184
3.3.3	Kompenzační dynamická kalorimetrie	187
3.4	Metody spojené se změnou jiných fyzikálních vlastností zkoumané látky	189
3.4.1	Termodilatometrie	189
3.4.2	Termomechanická měření	191

3.4.3	Emanační termická analýza	193
3.4.4	Termomagnetometrie	196
3.4.5	Termoelektronometrie	198
3.5	Literatura (Metody termické analýzy)	204
4.	Základy krystalografie a rentgenové difrakční analýzy	205
4.1	Základy krystalografie	205
4.1.1	Mříže, buňky, struktura	205
4.1.2	Symetrie v krystalové struktuře	211
4.1.2.1	Uzavřené operace symetrie	212
4.1.2.2	Bodové grupy symetrie	214
4.1.2.3	Otevřené operace symetrie	216
4.1.2.4	Prostorové grupy symetrie	221
4.2	Rentgenové záření	227
4.2.1	Spojité a charakteristické rentgenové záření	227
4.2.2	Absorpce rentgenového záření a fluorescenční záření	230
4.2.3	Detekce rentgenového záření	231
4.2.4	Bezpečnost práce s rentgenovým zářením	232
4.3	Difrakce rentgenového záření	233
4.3.1	Geometrická distribuce difrakcí	234
4.3.2	Intenzita difrakcí	235
4.3.2.1	Strukturní faktor	235
4.3.2.2	Systematické vyhasínání difrakcí	236
4.3.2.3	Další faktory ovlivňující intenzitu difrakcí	237
4.3.3	Využití difrakce rentgenova záření	238
4.3.3.1	Laueho metoda	238
4.3.3.2	Monokrystalové metody a určení úplné struktury	238
4.3.3.3	Polykrystalické (práškové) metody	239
4.3.3.4	Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza	243
4.3.3.5	Indexace difrakčních čar a výpočet mřížkových parametrů	247
4.3.3.6	Určení velikosti krystálů z rozšířených difrakčních linií	249
4.3.3.7	Rietveldova metoda	249
4.4	Literatura (Základy krystalografie a rentgenové difrakční analýzy)	252
Obsah		253
28012.3	Sedimentační a proudové metody	2.10.1
28012.4	Optické metody využívající optického filamentu	2.10.2
28012.4.1	Fraunhoferov obrazový mikroskop	2.10.2
28012.4.2	Metoda dynamického responzu světla	2.10.3
28012.5	Metody založené na základě sítě	2.10.3
28012.6	Výška emisního kruhu	2.10.3
28012.7	Velikost částic (PSD)	2.10.4
28012.7	Přesnost a reproducovatelnost výsledků	2.10.4